



Poznań, dnia 14.10.2020r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę ręcznego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, nr sprawy ZP/2744/D/1/20.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2019r., poz. 1843) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytanie i odpowiedź:

1. Czy Zamawiający dopuści ofertę na spektrometr XRF o parametrach poniżej:

- konstrukcja umożliwiająca pracę w warunkach laboratoryjnych jak i polowych (pistolet). Klasa ochrony IP 54
- detektor SDD o oknie z grafenu; rozdzielczość <145 eV przy liczbie zliczeń 500 000 na sekundę (linia k alfa Mn)
- zakres oznaczania pierwiastków: magnez (Mg) - uran (U) w próbkach geologicznych i archeologicznych
- wyposażony w tryb do badania próbek niemetalicznych (ceramika, szkło, obsydian)
- wyposażony w tryb do badania próbek metalicznych współczesnych i starożytnych (np. stopy miedzi)
- posiada oprogramowanie umożliwiające samodzielną kalibrację spektrometru
- wyposażony w automatyczny, filtr kołowy, którego położenie jest dobierane automatycznie przez oprogramowanie
- spektrometr wykrywa i analizuje zawartość pierwiastków ilościowo bez osłony helowej
- wyposażony w walizkę transportową, statyw nabiurkowy oraz statyw trójnożny
- wyposażony w dodatkowe oprogramowanie umożliwiające obserwację widma w czasie rzeczywistym oraz dający możliwość wykonywania analizy ilościowej

ODPOWIEDŹ:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o przedstawionych powyżej parametrach.

Ze względu na specyfikę pomiarów archeometrycznych koniecznym parametrem jest oznaczanie pierwiastków od fluoru dla zapewnienia możliwości oznaczania np. sodu (m.in. analiza szkła); konieczna jest (oprócz pracy w warunkach otoczenia) możliwość zastosowania pompy próżniowej i alternatywnie atmosfery helu (np. analiza szkła). Ponadto konieczna jest dodatkowa



możliwość samodzielnego (ręcznego) doboru i wymiany filtra poza automatycznie wybieranymi przez aparat; wśród wbudowanych kalibracji konieczna jest kalibracja dla próbek geologicznych. Wymagany przez Zamawiającego elementem jest również możliwość rejestracji fotografii analizowanego obszaru - niezmiernie istotne przy analizie obiektów zabytkowych. Kolejnym istotnym wymogiem dla Zamawiającego w kwestii oprogramowania jest oprócz obserwacji widma i analizy ilościowej możliwość pracy z bardzo dużą ilością widm jednocześnie (nakładanie, odejmowanie obszarów wspólnych, itp.) stosowane przez Zamawiającego w analizie porównawczej przy mapowaniu obiektów. Zaproponowany aparat nie spełni zatem oczekiwań Zamawiającego, wynikających ze specyfiki prowadzonych badań.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DZIEKAN
Wydziału Archeologii

prof. dr hab. Andrzej Michałowski